

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-20795-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 25.02.2020

Ausstellungsdatum: 25.02.2020

Urkundeninhaber:

**Kapraun Prüfdienst für Messplatten, Inhaber: Thomas Jakob, e.K.
Hammerstraße 1, 63857 Waldaschaff**

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Ebenheit** *)

Winkel

- **Winkelnormale** *)

*) als Vor-Ort-Kalibrierung

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Länge Ebenheit Horizontale Eben- heitsverkörperungen	bis 50 µm	bis 10 m Kantenlänge VA 7.2-3:2019-08		$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Ebenheitsverkörperung z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984
Winkel 90°-Winkelnormale mit ebenen Flächen aus Hartgestein oder ähnlichem Material	bis 50 µm	bis 2 m Schenkellänge VA 7.2-4:2019-10		$1 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge am Schenkel

verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
VA	Verfahrensanweisung von Kapraun Prüfdienst für Messplatten, Inhaber: Thomas Jakob, e.K.

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.